

# Поглощение и рассеяние света в квазиульмерных структурах. I. Дипольные моменты переходов носителей заряда

© С.И. Покутний

Украинский государственный морской технический университет,  
327025 Николаев, Украина

(Поступила в Редакцию 2 декабря 1996 г.)

Развита теория взаимодействия электромагнитного поля с локальными состояниями носителей заряда, возникающими вблизи малой диэлектрической частицы. Показано, что дипольные моменты переходов для локальных состояний имеют большие значения, превосходящие типичные значения дипольных моментов переходов для полупроводников.

1. В настоящее время интенсивно исследуются оптические свойства квазиульмерных структур, представляющих собой малые сферические диэлектрические (в частности, полупроводниковые) частицы размером  $a \sim 1-10^2$  nm, диспергированные в различных прозрачных диэлектрических средах [1,2].

В [3] с использованием простой модели квазиульмерной структуры были проанализированы условия локализации носителей заряда в окрестности сферической поверхности раздела двух диэлектрических сред. Эта модель представляла собой нейтральную сферическую диэлектрическую частицу радиусом  $a$  с диэлектрической проницаемостью (ДП)  $\epsilon_2$ , окруженную средой с ДП  $\epsilon_1$ , и квазичастицу с зарядом  $e$ , движущуюся либо в среде с  $\epsilon_1$  с эффективной массой  $m_1$  вблизи границы раздела (внешняя задача), либо с эффективной массой  $m_2$  внутри сферического объема в среде с  $\epsilon_2$  (внутренняя задача). Возникающее при этом поляризационное взаимодействие  $U(r, a)$  (где  $r$  — расстояние носителя заряда до центра частицы) с индуцированным на сферической поверхности раздела поверхностным зарядом зависело от величины относительной ДП  $\epsilon = \epsilon_1/\epsilon_2$ . Для носителей заряда, движущихся вблизи диэлектрической частицы, существуют две возможности: 1) поляризационное взаимодействие  $U(r, a)$  приводит к притяжению носителя заряда к поверхности частицы (при  $\epsilon < 1$  к внешней поверхности частицы, при  $\epsilon > 1$  к внутренней поверхности) и образованию соответственно внешних поверхностных состояний [4,5] и внутренних поверхностных состояний [6]; 2) при  $\epsilon < 1$  поляризационное взаимодействие  $U(r, a)$  вызывает отталкивание носителя заряда от внутренней поверхности диэлектрической частицы и возникновение в ее объеме объемных локальных состояний. При этом спектр низколежащих объемных состояний имеет осцилляторный вид [7,8].

В [3-8] было показано, что наименьший критический размер частицы  $a_c$ , при котором появлялось локальное состояние, был близок к величине среднего расстояния носителя заряда, локализованного над плоской поверхностью раздела в основном состоянии, от поверхности раздела ( $b_i$ )

$$a_c \sim b_i = 6 \left| \frac{\epsilon_2 + \epsilon_1}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \right| a_{B_i}, \quad (1)$$

где  $a_{B_i} = \epsilon_i(m_0/m_i)(\hbar^2/m_0e^2)$  — боровский радиус заряда в среде с ДП  $\epsilon_i$  ( $i = 1, 2$ ),  $m_i$  и  $m_0$  — эффективная масса носителя заряда в среде с ДП  $\epsilon_i$  и масса свободного заряда.

Вариационным методом в [6] и [4] был найден спектр поверхностных внутренних и внешних состояний. При этом для внутренних поверхностных состояний [6] были использованы следующие вариационные волновые функции:

$$\chi_l(x, S_2) = A(S_2 - x)^{l+1} x(2S_2 - x) \exp(-\gamma_l x), \quad (2)$$

а для внешних поверхностных состояний [4] — следующие:

$$\chi_l(x, S_1) = Bx(x + S_1) \exp(-\mu_l x), \quad (3)$$

где  $l$  — орбитальное квантовое число заряда,  $S_i = a/b_i$ ,  $x$  — расстояние носителя заряда до поверхности частицы в единицах  $b_i$  (1). Вариационные параметры  $\gamma(S_2)$  и  $\mu(S_1)$  как функции радиуса частицы  $S_i$  для  $l = 0$  и 1 изображены на рис. 1, 2.

В настоящее время имеется достаточное количество экспериментальных работ, в которых наблюдались ука-

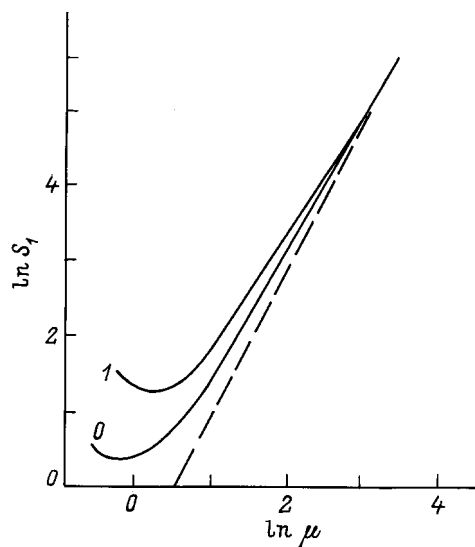
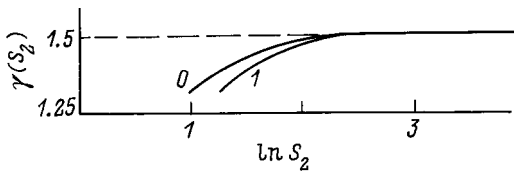


Рис. 1. Зависимость вариационного параметра  $\mu(S_1)$  от радиуса частицы  $S_1$ . Цифры около кривых указывают значения  $l$ . Штриховая линия —  $S_1 = (2/3)\mu$ .



**Рис. 2.** Зависимость вариационного параметра  $\gamma(S_2)$  от радиуса диэлектрической частицы  $S_2$ . Цифры около кривых указывают значения  $l$ .

занные одночастичные локальные состояния. Так, например, экспериментально изучалась локализация носителей заряда и экситонов в малых частицах хлорида меди [1] и сульфида кадмия [2,9], а также в изоэлектронных твердых растворах  $A_2B_6$  [10,11]. Кроме того, в [12] наблюдалась локализация носителей тока в германии  $n$ -типа на малых частицах сурьмы и на частицах ртути, помещенных в плотные пары [13].

Между тем поведение квазиульмерных структур в поле световой волны остается практически неизученным. Чтобы заполнить пробел, в настоящей работе развита теория взаимодействия электромагнитного поля с вышеуказанными одночастичными локальными состояниями в квазиульмерных системах.

2. В области частот, соответствующих рассмотренным состояниям носителей заряда вблизи сферической поверхности раздела двух сред, длина волны намного больше размеров всех локальных состояний ( $\sim b_i$  (1)), поэтому их поведение в электромагнитном поле хорошо описывается дипольным приближением. При этом операторы дипольного момента для внешней и внутренней задачи соответственно имеют вид [14]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \left[ 1 - \frac{\beta}{1 + \alpha} \left( \frac{a}{r} \right)^3 \right] \mathbf{er}, \quad (4)$$

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \frac{3\varepsilon_1}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \mathbf{er}, \quad (5)$$

где параметры  $\alpha = (\varepsilon_1/(\varepsilon_1 + \varepsilon_2))$  и  $\beta = ((\varepsilon_2 - \varepsilon_1)/(\varepsilon_2 + \varepsilon_1))$ .

Для оценки величин дипольных моментов достаточно рассмотреть переходы между нижайшими локальными состояниями всех рассмотренных типов, например между основными  $s$ - и  $p$ -состояниями. Такие переходы с изменением орбитального квантового числа ( $l' = l \pm 1$ ) на единицу разрешены правилами отбора для дипольных переходов [15]. Для вычисления матричного элемента дипольного момента перехода  $D_{1,0}(S)$  носителя заряда из  $s$ - в  $p$ -состояние предположим, что однородное поле световой волны  $E(\omega, t)$  направлено только по оси  $z$  ( $\omega$  — частота волны). При этом в качестве возмущения, вызывающего такие дипольные переходы, возьмем индуцируемые полем  $E(\omega, t)$  дипольные моменты  $\mathbf{D}(\mathbf{r})$  (4) для внешней и  $\mathbf{D}(\mathbf{r})$  (5) для внутренней задачи.

Для объемных осцилляторных состояний [7,8] такому дипольному переходу соответствует переход между

состояниями с квантовыми числами  $l = 0$  и  $1$ . С учетом (5) величина матричного элемента дипольного момента перехода  $D_{1,0}(S_2)$  между такими состояниями, локализованными в центре диэлектрической частицы, имеет вид [15]

$$D_{1,0}(S_2) = \frac{3\varepsilon_1}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} 3^{-7/6} 2^{-3/2} S_2^{3/4} \left[ \frac{8\beta}{3(1 + \alpha)} + \frac{2(7 + 5\alpha)}{2 + \alpha} \left( \frac{\beta}{1 + \alpha} S_2^{-1} \right)^{1/2} + \frac{(8 + 11\alpha + 5\alpha^2)}{2 + \alpha} S_2^{-1} \right]^{-1/4} eb_2. \quad (6)$$

Для оценки величин дипольных переходов на внутренних  $D_{1,0}(S_2)$  и внешних  $D_{1,0}(S_1)$  поверхностных состояниях можно воспользоваться вариационными волновыми функциями (2) и (4). При этом с учетом (2) и (5), а также (3) и (4) получим матричные элементы дипольных переходов между основными состояниями с  $l = 0$  и  $1$  для внутренних поверхностных состояний

$$D_{1,0}(S_2) = \frac{3\varepsilon_1}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} 16 \cdot 3^{-1} \cdot 6^{1/2} S_2 \frac{\tilde{\mu}_0^{7/2} \tilde{\mu}_1^{9/2}}{\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1} \times \left[ (\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1)^5 - 16(\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1)^4 + 125(\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1)^3 - 570(\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1)^2 + 1470(\tilde{\mu}_0 + \tilde{\mu}_1) - 1680 \right] \times (8\tilde{\mu}_0^4 - 36\tilde{\mu}_0^3 + 78\tilde{\mu}_0^2 - 90\tilde{\mu}_0 + 45)^{-1/2} \times (4\tilde{\mu}_1^6 - 30\tilde{\mu}_1^5 + 123\tilde{\mu}_1^4 - 330\tilde{\mu}_1^3 + 585\tilde{\mu}_1^2 - 630\tilde{\mu}_1 + 315)^{-1/2} eb_2, \quad (7)$$

где

$$\tilde{\mu}_0(S_2) = \gamma_0(S_2)S_2, \quad \tilde{\mu}_1(S_2) = \gamma_1(S_2)S_2$$

и для внешних поверхностных состояний

$$D_{1,0}(S_1) = 4 \cdot 3^{-1/2} \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} S_1 \times \frac{(\mu_0\mu_1)^{5/2}}{(\mu_0 + \mu_1)^6(\mu_0^2 + 3\mu_0 + 3)^{1/2}} \times \left[ 3(\mu_0 + \mu_1)^2 + 12(\mu_0 + \mu_1) + 20 \right] \times (\mu_1^2 + 3\mu_1 + 3)^{-1/2} eb_1, \quad (8)$$

где вариационные параметры  $\mu_0(S_1)$ ,  $\mu_1(S_1)$ ,  $\gamma_0(S_2)$ ,  $\gamma_1(S_2)$ , которые содержатся в пробных волновых функциях внешних и внутренних поверхностных состояний соответственно, определены рис. 1 и 2.

Следует отметить, что выражение для дипольного момента перехода  $D_{1,0}(S_2)$  (7) для внутренних поверхностных состояний было получено при выполнении условий

$\exp(-\gamma_1 S_2)$ ,  $\exp(-\gamma_0 S_2) \ll 1$ . Такие условия хорошо выполняются для произвольных значений вариационных параметров  $\gamma_0(S_2)$ ,  $\gamma_1(S_2)$  (рис. 2) и для всех значений размеров диэлектрических частиц  $S \gg S_c$  (1).

В качестве примера приведем здесь значения дипольных моментов переходов  $D_{1,0}(S_1)$  (8) для внешней и  $D_{1,0}(S_2)$  (7) для внутренней задачи в диэлектрической частице с радиусом  $S_1 = S_2 = S = 4$

$$D_{1,0}(S_1) = 7.6 \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} eb_1, \quad (9)$$

$$D_{1,0}(S_2) = 4.2 \frac{\varepsilon_1}{2\varepsilon_1 + \varepsilon_2} eb_2. \quad (10)$$

С ростом радиуса частицы  $S$  значения дипольных моментов переходов  $D_{1,0}(S_1)$  (9) и  $D_{1,0}(S_2)$  (10) практически не меняются, лишь слегка увеличиваясь при  $S \rightarrow \infty$  в пределах фактора порядка единицы. Это, естественно, отражает тот факт, что размер диполя имеет порядок величины размера состояния  $b_i$  (1), который практически не меняется. Следует отметить, что именно благодаря этому обстоятельству использование вариационных функций (2) и (3) для оценки величин матричных элементов дипольных моментов переходов не вносит существенной ошибки, а может лишь отражаться на численном коэффициенте порядка единицы.

3. В заключение кратко обсудим возможные физические ситуации, для которых актуальны полученные результаты. Интересной особенностью состояний носителей заряда, локализованных на сферической поверхности раздела двух сред, является снятие вырождения по орбитальному квантовому числу  $l$ , вследствие чего даже в основном состоянии расстояние между подуровнями будет достаточно малым [4–8]. Если учесть, что дипольные моменты переходов для всех рассмотренных нами типов локальных состояний, согласно (6)–(8), имеют большие значения  $D_{1,0}(a) \sim eb_i \gg 1D$  (во много раз превосходящие типичные значения дипольных моментов переходов для неограниченных полупроводниковых материалов, в которых они  $\sim 10^{-1}D$  [16], а дипольные переходы в электромагнитном поле между ближайшими уровнями разрешены правилами отбора с изменением  $l$  на единицу, то очевидно, что рассматриваемые нами квазиульмерные системы являются сильно нелинейными средами для электромагнитного излучения.

Последнее обстоятельство представляет особый интерес для создания новых нелинейных элементов в широкой области длин волн, которая может варьироваться в зависимости от природы контактирующих материалов. В качестве примера приведем квазиульмерную систему, состоящую из полупроводниковой частицы CdS размером  $a \simeq 54 \text{ \AA}$ , помещенной в матрицу борно-силикатного стекла. В такой системе были экспериментально обнаружены осцилляторные состояния дырки, локализованной вблизи центра частицы с энергией  $\sim 10^2 \text{ meV}$  [9]. Как было показано в [17,18], спектр объемных локальных состояний дырки в условиях эксперимента [9] состоял

из эквидистантной серии уровней, расстояние между которыми  $\sim a^{-3/2}$ . Дипольные моменты переходов дырки между такими эквидистантными уровнями, согласно (6), принимают значения порядка  $D_{1,0} \sim 10\text{--}20D$ . Поэтому такие квазиульмерные системы являются сильно нелинейными средами для ИК-излучения.

## Список литературы

- [1] А. Екимов, А. Онущенко. Письма в ЖЭТФ **34**, 6, 363 (1981).
- [2] Shepik D., A. Efros. J. Lumin. **47**, 3, 113 (1990).
- [3] Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ **27**, 1, 48 (1985).
- [4] Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ **32**, 10, 2921 (1990).
- [5] Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ **33**, 10, 2845 (1991).
- [6] S. Pokutnyi. Phys. Stat. Sol. (b) **165**, 1, 109 (1991).
- [7] S. Pokutnyi. Phys. Stat. Sol. (b) **172**, 2, 573 (1992).
- [8] С.И. Покутний. ФТТ **35**, 2, 257 (1993).
- [9] А. Екимов, А. Онущенко, А. Эфрос. Письма в ЖЭТФ **43**, 6, 292 (1986).
- [10] С. Пермогоров, А. Резницкий, С. Вербин. Изв. АН СССР. Сер. физ. **49**, 10, 2019 (1985).
- [11] А. Резницкий, С. Пермогоров. Изв. АН СССР. Сер. физ. **52**, 691 (1988).
- [12] В. Шаховцов, С. Шаховцова, И. Ясковец. ФТП **11**, 10, 1967 (1977).
- [13] P. Krebs, V. Girand. Phys. Rev. Lett. **44**, 3, 211 (1980).
- [14] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М. (1982).
- [15] Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. Препринт ИС АН СССР № 1 (1984).
- [16] В.М. Агранович. Теория экситонов. М. (1968).
- [17] С.И. Покутний. ФТП **25**, 4, 628 (1991).
- [18] S. Pokutnyi. Phys. Lett. (b) **168**, 5–6, 433 (1992).